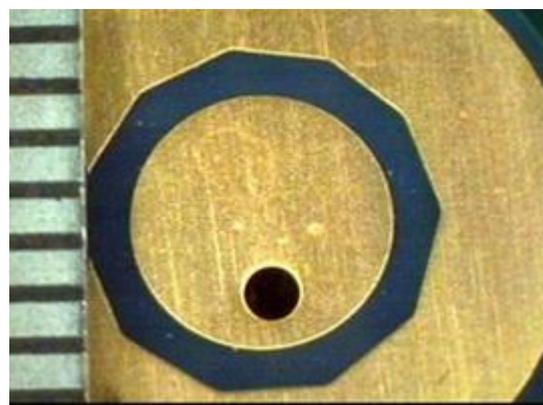


[概要]

基板上に付着した約 0.1 mmの微小異物を IR 顕微反射法で測定した。異物は炭酸カルシウムの標準 IR スペクトルと一致した。

さらに、蛍光 X 線分析よりカルシウムが検出された。このため、異物は炭酸カルシウムであることが判明した。



電子部品上の微小異物

